課題番号 :F-19-OS-0026

利用形態:機器利用

利用課題名(日本語) :ナノ材料の変形・破壊に及ぼす応力集中の影響

Program Title (English) : Influence of stress concentration on deformation and fracture of nanomaterials

利用者名(日本語) : <u>近藤俊之</u> 原田雄斗 Username (English) : <u>T. Kondo</u>, Y. Harada

所属名(日本語) :大阪大学大学院工学研究科

Affiliation (English) :Osaka University

キーワード/Keyword:ナノ材料,変形・破壊,膜加工・エッチング

1. 概要(Summary)

マクロ材の変形・破壊は、材料中の欠陥に生じる応力 集中場が支配する. 一方、材料の寸法が nm オーダー まで縮小したナノ材料においても、欠陥における応力集 中場が変形・破壊を支配するかは明らかではない. そこで 本研究では、 直径が 100 nm オーダーのナノワイヤに 制御された欠陥(切欠き)を加工し、これに対する引張試 験を実施して変形・破壊に及ぼす応力集中の影響を解 明する.

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

高精細集束イオンビーム装置(ヘリウムイオン顕微鏡) (ZEISS 社 ORION NanoFab)

【実験方法】

直径が約 200 nm のアルミニウムナノワイヤに対して、 高精細集東イオンビーム装置を用いて片側切欠きを加工 して試験片を作製し、これに対するその場電界放射走査 型電子顕微鏡(FESEM)観察引張試験を実施した.

3. 結果と考察(Results and Discussion)

集東ヘリウムイオンビーム加工により、切欠き長さが約 15 nm の試験片と約 50 nm の試験片を作製した. 長さ約 50 nm 切欠きを有するナノワイヤの引張試験前後の FESEM 像を Fig. 1 に示す. 破壊は切欠き部で生じた. 長さが約 15 nm の切欠き試験片でも, 同様に切欠き部で破壊した.

平滑材と切欠き材の応力-ひずみ関係を Fig. 2 に示す. 切欠き試験片の破壊強度は平滑試験片に対して減少し, また切欠き深さが大きくなるほど減少量は大きくなった. 以上の結果は, ナノワイヤにおいても応力集中場の強さ

が破壊を支配することを示唆している.

4. その他・特記事項(Others)

なし.

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

(1) 原田雄斗,近藤俊之,箕島弘二,"切欠きを有するナノワイヤの破壊強度特性",日本機械学会関西支部第95期定時総会講演会,同志社大学,310(2020.3.12).

6. 関連特許(Patent)

なし.

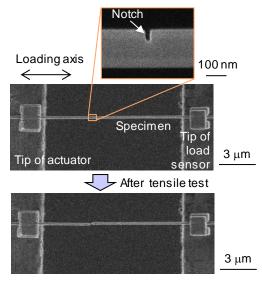


Fig. 1 In situ FESEM images of the tensile test on the notched nanowire.

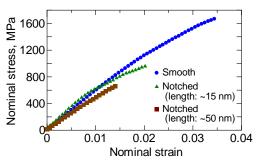


Fig. 2 The relationship between nominal stress and nominal strain of the smooth and notched nanowires.